

教科目名 パターン認識 (Pattern Recognition)

専攻名・学年 : 電気電子情報工学専攻 1 年 (教育プログラム 第 3 学年 ○科目)

単位数など : 選択 2 単位 (前期 1 コマ, 授業時間 23.25 時間)

担当教員 : Prochazka Zdenek

| 授業の概要 | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| コンピュータによるパターン認識の基礎及び、パターン認識を実現するための代表的な手法について学ぶ。 | | | 大分高専目標 (E1), JABEE 目標 (d2a) |
| 回 | 授業項目 | 内 容 | 理解度の自己点検 |
| 1 | 1. <u>パターン認識とは</u> パターン認識系の構成、特徴ベクトルと特徴空間、プロトタイプと最近傍決定則 | ○パターン認識の位置付けとパターン認識に関わる基本的な事項を学ぶ。 | 【理解の度合い】 |
| 2-3 | 2. <u>学習と識別関数</u> 学習の必要性、最近傍決定則と線形識別関数、ペーセプトロンの学習規則 | ○ペーセプトロンの学習則を中心に、機械学習の基礎的な手法について学ぶ。 | |
| 4 | 3. <u>誤差評価に基づく学習</u> Widrow-Hoff の学習規則、誤差評価とペーセプトロン、誤差逆伝播法 | ○上記で導入した学習法をさらに拡張し、多層ニューラルネットワークの学習法を導入する。 | |
| 5-6 | 4. <u>識別部の設計</u> パラメトリックな学習とノンパラメトリックな学習、パラメータ推定、識別関数の設計、特徴空間の次元数と学習パターン数、識別部の最適化 | ○パターンの識別を確率の観点から捉えた識別手法について学ぶ。 | |
| 7 | 5. <u>特徴の評価とベイズ誤り率</u> 特徴の評価、ベイズ誤り率 | ○特徴の良さの評価及び識別手法の誤り率について学ぶ。 | |
| 8 | 6. <u>特徴空間の変換</u> 特微量の選択と特徴空間の変換、特微量の正規化、KL 展開、線形判別法 | ○KL 展開を中心にして、特徴抽出手法について学ぶ。 | |
| 9 | 前期中間試験 | | 【試験の点数】 点 【理解の度合い】 |
| 10 | 前期中間試験解説 | | |
| 11-12 | 7. <u>部分空間法</u> 部分空間法の基本、CLAFIC 法、部分空間法と類似度法、直交部分空間法 | ○KL 展開による部分空間を用いた識別手法について学ぶ。 | |
| 13 | 8. <u>学習アルゴリズムの一般化</u> 期待損失最小化学習、種々の損失、確率的降下法。 | ○損失という概念を導入し、それによる学習アルゴリズムの一般化について学ぶ。 | |
| 14 | 9. <u>学習アルゴリズムとベイズ決定則</u> 最小二乗法による学習 | ○最小二乗法による学習とベイズ決定則の関係について学ぶ。 | |
| 15 | 前期期末試験 前期期末試験の解答と解説 | | 【試験の点数】 点 |
| 履修上の注意 | | 講義の途中でもわからなくなったら、何時でも質問してよい。 線形代数およびの確率・統計の基礎を復習すること。 | 【総合達成度】 |
| 教科書 | 「わかりやすいパターン認識」、石井健一郎、上田修功、前田英作、村瀬洋、オーム社、平成 18 年 12 月 出版 | | |
| 参考図書 | 「パターン識別」 R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork 著、尾上守夫監訳 新技術コミュニケーションズ 2001/07 出版 | | |
| 自学上の注意 | 授業の内容をその日のうちに復習すること | | |
| 関連科目 | 画像工学(S 科)、信号処理(E 科) | | |
| 総合評価 | 達成目標の(1)~(4)について、定期試験と課題で評価する。定期試験の成績(80%)および課題の評価(20%)を合計し、これを総合評価とする。 単位取得条件は、総合評価が 60 点以上とする。再試験は実施しない。 | | 【総合評価】 点 |

